

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年6月15日(15.06.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/105553 A1

(51) 国際特許分類:
G01R 1/073 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/044633

(22) 国際出願日: 2021年12月6日(06.12.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 日本電子材料株式会社 (JAPAN
ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION)
[JP/JP]; 〒6600805 兵庫県尼崎市西長洲町 2
丁目 5 番 1 3 号 Hyogo (JP).

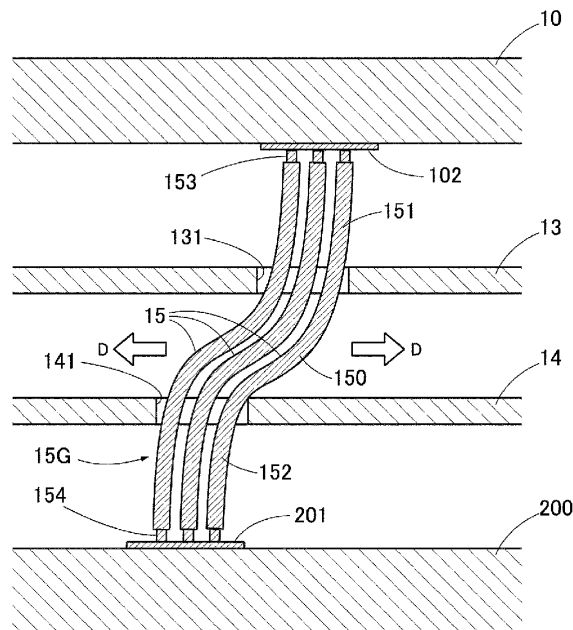
(72) 発明者: 森 親臣 (MORI Chikaomi); 〒6600805
兵庫県尼崎市西長洲町 2 丁目 5 番 1 3 号 日
本電子材料株式会社内 Hyogo (JP).

(74) 代理人: 大槻 聡 (OHTSUKI Satoshi); 〒5406125
大阪府大阪市中央区城見 2 - 1 - 6 1 ツイン
2 1 M I D タワー 2 5 階 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,

(54) Title: PROBE CARD

(54) 発明の名称: プローブカード



(57) Abstract: [Problem] One objective of the present invention is to provide a probe card with which contact failures do not readily occur. Another objective of the present invention is to provide a probe card having good high-frequency characteristics and current resistance, and having good conductivity. [Solution] This probe card comprises a wiring board 10 having one or more probe electrodes 102 formed thereon, an upper guide plate 13 which is separated downward from the wiring board 10, is disposed facing the wiring board 10, and has one or more upper guide holes 131 formed therein, a

[続葉有]

WO 2023/105553 A1

NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

lower guide plate 14 which is separated downward from the upper guide plate 13, is disposed facing the upper guide plate 13, and has one or more lower guide holes 141 formed therein, and a probe group 15G comprising two or more probes 15 which are inserted through the same upper guide hole 131 and are inserted through the same lower guide hole 141, and which are connected to the same probe electrode 102 and to the same electrode pad 201 on an object to be inspected, wherein the probes 15 constituting the probe group 15G are configured to be capable of undergoing buckling deformation independently of one another between the upper guide plate 13 and the lower guide plate 14, and are configured such that lower ends thereof are capable of moving independently of one another in a vertical direction.

(57) 要約: 【課題】 接触不良が生じにくいプローブカードを提供することを目的とする。また、高周波特性及び耐電流特性が良好であり、かつ、導通性も良好なプローブカードを提供することを目的とする。

【解決手段】 1又は2以上のプローブ電極102が形成された配線基板10と、配線基板10から下側に離間し、配線基板10と対向して配置され、1又は2以上の上部ガイド孔131が形成された上部ガイド板13と、上部ガイド板13から下側に離間し、上部ガイド板13と対向して配置され、1又は2以上の下部ガイド孔141が形成された下部ガイド板14と、同一の上部ガイド孔131内に挿通されるとともに、同一の下部ガイド孔141内に挿通された、同一のプローブ電極102及び検査対象物の同一の電極パッド201に接続される2以上のプローブ15からなるプローブ群15Gと、を備え、プローブ群15Gを構成する各プローブ15が、上部ガイド板13及び下部ガイド板14間において互いに独立して座屈変形することが可能であり、下端が互いに独立して上下方向に移動可能であるように構成される。